



Title of Change:	Update Datasheet of FAM65CR51DZ1/2 & FAM65HR51DS1/2, no impact on product integrity.	
Effective date:	14 Jun 2020	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Peter.Lee@onsemi.com	
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.	
Change Category:	APM16 datasheet change	
Change Sub-Category(s):	Product specific change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites
None		None
Description and Purpose:		
<u>Common Editorial changed items in both Datasheets:</u>		
- Moved document to new Datasheet template - added Parameter Description chapter - Fixed Typo on flaming standard to correct UL94V-0 - Fixed Typo to correct standard AQG324 - Added additional info to product overview table - Fixed Pagination numbering error - Made Characterization section text searchable in diagrams - Fixed note numbering - Reworded ISOLATION Table header to correct unit (resistance not voltage) - Updated package drawing and added straight lead version		
<u>Editorial changed items in Datasheet of FAM65CR51DZ2 only:</u>		
- Table 3, RDSon – removed T_C and clarified test condition of T_J=125°C - Added “not tested in production” note to t_a,t_b,t_{rr} and Q_{rr} test conditions		
<u>Common updates in technical specification:</u>		
- Added “not tested in production” note to Dynamic Characteristics table header - Added “not tested in production” note to Switching Timing table test conditions - Added “not tested in production” note to T_{rr} and Q_{rr} test conditions - Updated to same typ. switching timing values according to latest (wider) database		
<u>Updates in technical specification of FAM65CR51DZ2 only:</u>		
- Table 3, RDSon – removed T_C and clarified test condition of T_J=125°C - Added “not tested in production” note to t_a,t_b,t_{rr} and Q_{rr} test conditions		
List of Affected Standard Parts:		
Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the <u>PCN Customized Portal</u> .		
FAM65CR51DZ1 FAM65HR51DS2 FAM65CR51DZ2 FAM65HR51DS1		

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	FAM65CR51DZ1/2 と FAM65HR51DS1/2 のデータシート更新、製品の完全性に影響はありません。	
発効日:	14 Jun 2020	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター 営業所または Peter.Lee@onsemi.com にお問い合わせください。	
通知種別:	本製品速報は通知目的のみです。 オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。	
変更カテゴリ:	APM16 データシートの変更	
変更サブカテゴリ:	製品仕様の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点		外部製造工場/下請業者拠点
なし		なし
説明および目的:		
<u>両データシートにおける共通の編集上の変更項目:</u>		
- 新しいデータシートテンプレートを使用 - パラメータの説明の章を追加 - 燃焼規格の誤植を訂正して UL94V-0 を修正 - 誤植を訂正して AQG324 規格を修正 - 製品概要表に付加情報を追加 - ページ番号のエラーを修正 - 特性評価の章の図における文言を検索可能に変更 - ノートナンバリングを修正 - 単位を修正するための ISOLATION 表ヘッダーの書き直し (電圧ではなく抵抗) - パッケージ図面を更新し、ストレートリードバージョンを追加		
<u>FAM65CR51DZ2 のデータシートのみにおける編集上の変更項目:</u>		
- 表 3、RDSon – T_C 削除および T_J=125°C のテスト条件を明確化 - ta、tb、trr および Qrr テスト条件に「量産ではテストされていません」の注釈を追加		
<u>技術仕様の共通更新:</u>		
- 動的特性表のヘッダーに「量産ではテストされていません」の注釈を追加 - スイッチングタイミング表のテスト条件に「量産ではテストされていません」の注釈を追加 - trr および Qrr テスト条件に「量産ではテストされていません」の注釈を追加 - 最新の (より広範囲の) データベースに従って、同じタイプのスイッチングタイミング値に更新		
<u>FAM65CR51DZ2 のみの技術仕様の更新:</u>		
- 表 3、RDSon – T_C 削除および T_J=125°C のテスト条件を明確化 - ta、tb、trr および Qrr テスト条件に「量産ではテストされていません」の注釈を追加		
影響を受ける標準部品の一覧:		
注: 標準の部品番号 (既製品) のみが部品一覧に記載されます。 本 PCN に影響を受けるカスタム部品は、PCN メールの顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータル に記載されています。		
FAM65CR51DZ1 FAM65HR51DS2 FAM65CR51DZ2 FAM65HR51DS1		